

EsD2: Costruzione di D-Latch, contatori e shift-register

Gruppo 1.AC
Matteo Rossi, Bernardo Tomelleri
13 aprile 2022

1 Misura componenti dei circuiti

Riportiamo per completezza il valore della tensione continua di alimentazione per i circuiti integrati misurata con il multimetro

$$V_{CC} = 4.99 \pm 0.03V$$

e il valore di capacità del condensatore di disaccoppiamento che collega le linee di alimentazione a massa (sempre misurato con il multimetro)

$$C_d = 97 \pm 4 \text{ nF}$$

2 D-Latch con Enable

2.a Costruzione del circuito

Si è costruito un circuito D-Latch secondo lo schema mostrato in fig. 1 utilizzando le porte NAND di due integrati SN74LS00.

Per studiarne il comportamento generiamo nei due pin DIO 0 (DATA) e DIO 1 (ENABLE) dell'AD2 due segnali di clock di frequenza $f = 1 \text{ kHz}$ e sfasati tra loro di 90° agli ingressi D ed E del circuito.

2.b Analisi del funzionamento del circuito

Il circuito è composto da un Latch RS i cui ingressi sono collegati a due porte NAND, di cui un ingresso per ciascuna è collegato all'input E , mentre gli altri due ingressi sono collegati l'uno al segnale opposto dell'altro tramite una porta NOT (in figura la porta NAND più in alto tra le due (R) è collegata all'input D , mentre quella più in basso (S) a \bar{D}).

L'equazione fondamentale del circuito è quindi data dalla

$$Q(t + \Delta t) = \overline{(\bar{D} \cdot E)} + \overline{(\bar{D} \cdot E)} \cdot Q(t) = E \cdot D + \bar{E} \cdot Q(t) \quad (1)$$

da cui si può ricavare la corrispondente tabella di verità

Come si può vedere dalla tabella di verità (tabella 1) l'uscita Q funge da memoria a un bit se E è al livello logico basso (stato di HOLD), mentre assume il valore logico dell'input D quando il segnale di ENABLE è acceso. Questo rende il valore dell'uscita indipendente dalle caratteristiche temporali delle porte NAND e protegge il circuito dallo stato proibito di oscillazione/racing $R = S = 1$ da cui è affetto il semplice RS -Latch.

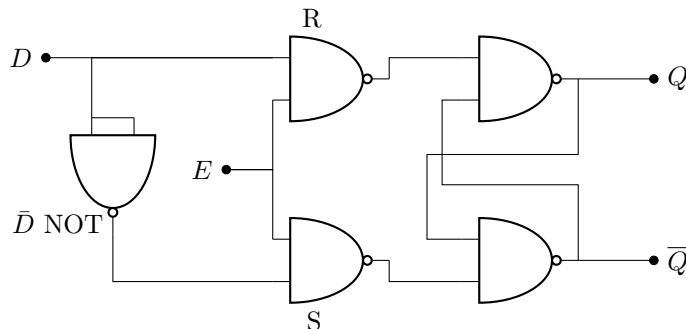


Figura 1: Schema logico del circuito D-Latch (con Enable) realizzato

E	D	$Q(t)$	$Q(t + \Delta t)$
0	X	0	0
0	X	1	1
1	0	X	0
1	1	X	1

Tabella 1: Tabella di verità del circuito D -Latch con Enable (con X si indica valore logico indefinito/don't care)

2.c Verifica della tabella di verità del Latch

Per conferma del corretto funzionamento del Latch possiamo confrontare le uscite ottenute da un'acquisizione con Logic Analyzer con i valori riportati in tabella 1 inviando all'ingresso del circuito con Patterns due segnali di clock sfasati tra loro di $\varphi = \pm 90^\circ$.

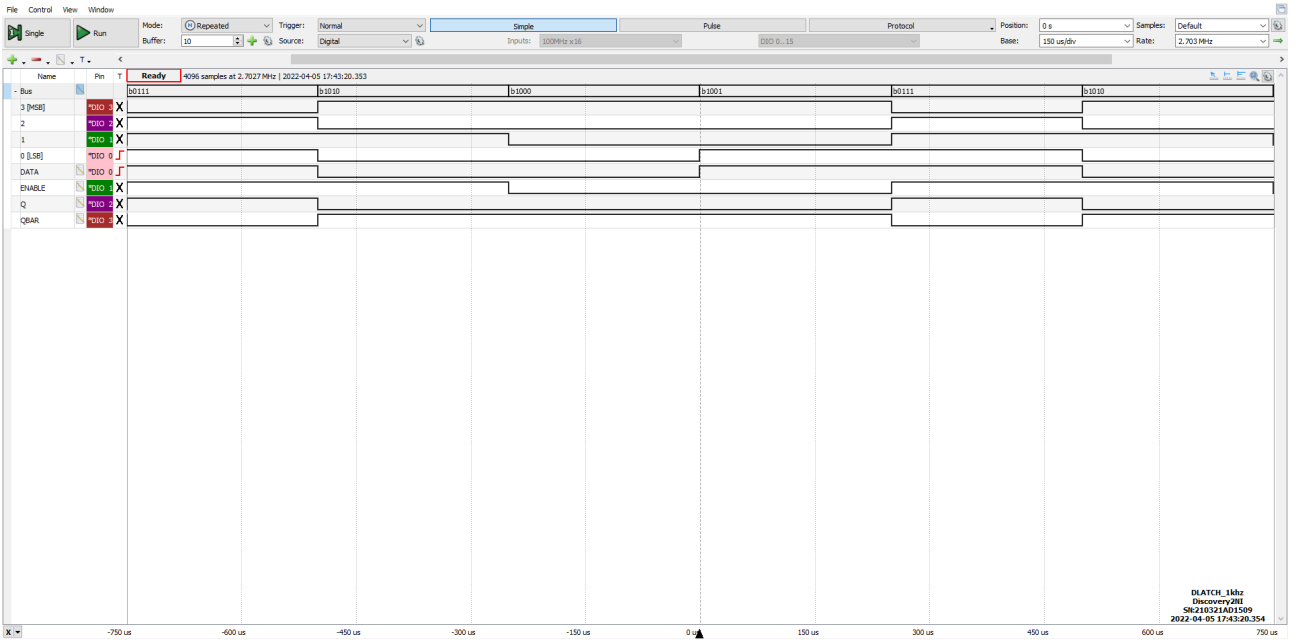


Figura 2: Acquisizione di un ciclo completo (frequenza 1 kHz) con Logic Analyzer dei segnali in ingresso ($D = \text{DIO } 0$, $E = \text{DIO } 1$) e in uscita ($Q = \text{DIO } 2$, $\bar{Q} = \text{DIO } 3$) dal D -Latch.

Dalle fig. 2 e fig. 3 si osserva come durante lo stato basso di Enable il segnale in uscita rimanga costante rispetto a variazioni del segnale in D , mentre quando $E = 1 \implies Q(t + \Delta t) = D$ coerentemente con quanto previsto dalla tabella di verità.

2.d Misura dei tempi del ritardo nelle transizioni di stato

Si riescono a distinguere due diverse transizioni dei segnali in ingresso per ciascun valore di sfasamento tra i due segnali di clock in D ed E ; per $\varphi = 90^\circ$:

1. $D : 1 \rightarrow 0$, $E := 1$
2. $D := 1$, $E : 0 \rightarrow 1$.

Mentre per $\varphi = -90^\circ = 270^\circ$:

3. $D := 0$, $E : 0 \rightarrow 1$
4. $D : 0 \rightarrow 1$, $E := 1$.

Il ritardo di durata maggiore risulta quello della transizione 1 dell'input D da alto a basso (40 ± 10 ns).

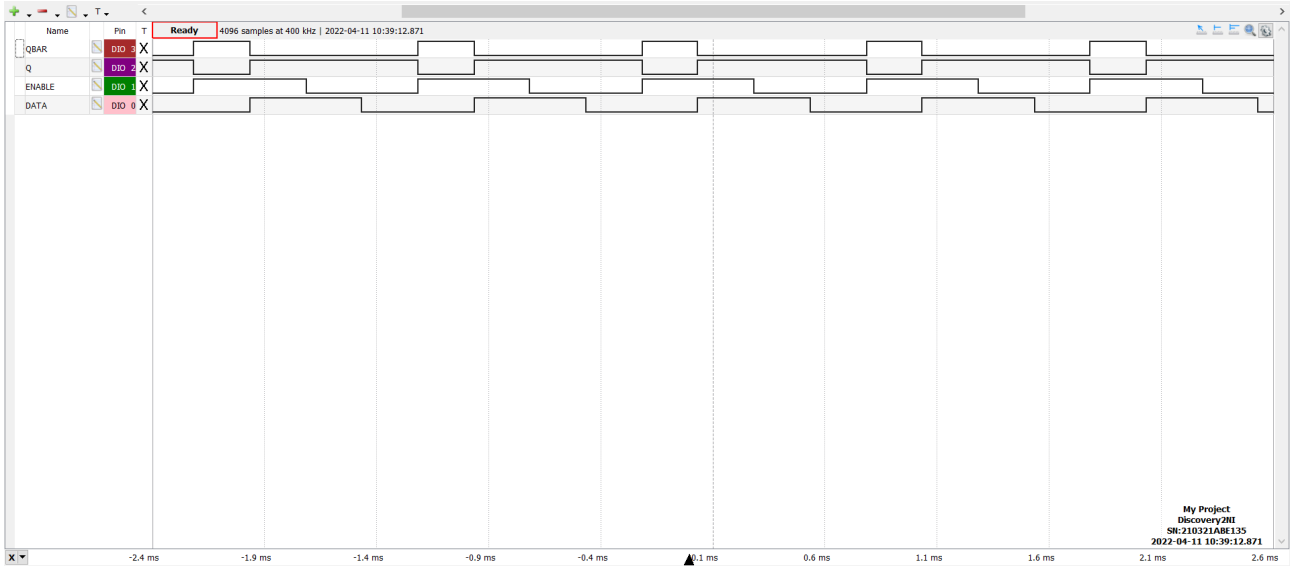


Figura 3: Acquisizione temporale con Logic dei segnali in ingresso uscita dal D-Latch per $\varphi = -90^\circ$.

Dalle misure prese con i cursori dell'oscilloscopio (a cui associamo come incertezza il contributo dato dalle specifiche del datasheet, tenendo conto dell'instabilità e dello spessore delle tracce sullo schermo) troviamo

$$t_{PLH} = 11 \pm 1 \text{ ns}$$

$$t_{PHL} = 35 \pm 2 \text{ ns}$$

Dalle specifiche del DS si trova che i tempi di propagazione tipici e massimi per una singola porta NAND sono:

	typ	max	[units]
t_{PLH}	11	22	ns
t_{PHL}	7	15	ns

3 Shift-register con edge-triggered D-Flip Flop

3.a Costruzione del circuito

Si vuole ora costruire uno Shift Register a 4 bit a partire dagli integrati della serie SN74LS74, secondo lo schema in fig. 4 e verificarne il funzionamento.

3.b Verifica della sincronia delle uscite tramite PRESET

Per prima cosa dopo aver montato il circuito verifichiamo la sincronicità delle commutazioni delle uscite. Dopo aver controllato che le uscite Q0, Q1, Q2 e Q4 fossero nello stato 0000, mantenendo il segnale di clock e il D-Switch scollegati abbiamo utilizzato la funzione StaticIO di wavegen per pilotare il pin PRE-BUTTON di fig. 4 tramite un button di tipo pressed=0 e released=1 e Logic per programmare un trigger che facesse partire l'acquisizione alla pressione del button, osservando le tracce prodotte dai 4 segnali in uscita. Dalla figura fig. 5 vediamo che le commutazioni delle uscite avvengono in maniera sincrona, a un $\Delta T = 40\text{ns}$ a partire dalla pressione del pulsante di preset; successivamente le 4 uscite hanno raggiunto lo stato 1111.

3.c Verifica del funzionamento tramite clock

A questo punto si vuole verificare il funzionamento del registro a scorrimento tramite un segnale di clock. Possiamo quindi costruire una tabella di verità in funzione del tempo del registro a partire dal periodo T del clock inviato: Come strategia per la verifica, utilizzeremo inizialmente il pulsante di preset per inizializzare tutte le uscite a 1, successivamente imposteremo il D-Switch tramite StaticIO come switch di tipo Push-Pull impostandolo a 0 e invieremo un segnale di clock dell'ordine di 1 Hz. Utilizzeremo quindi Logic per acquisire gli andamenti nel tempo delle uscite. Dunque ci si aspetta che dopo 3 periodi di clock (3 secondi) a partire da quando l'uscita Q0 diventa 0, tutte le uscite diventino 0, e che aspettando ulteriormente questi valori non

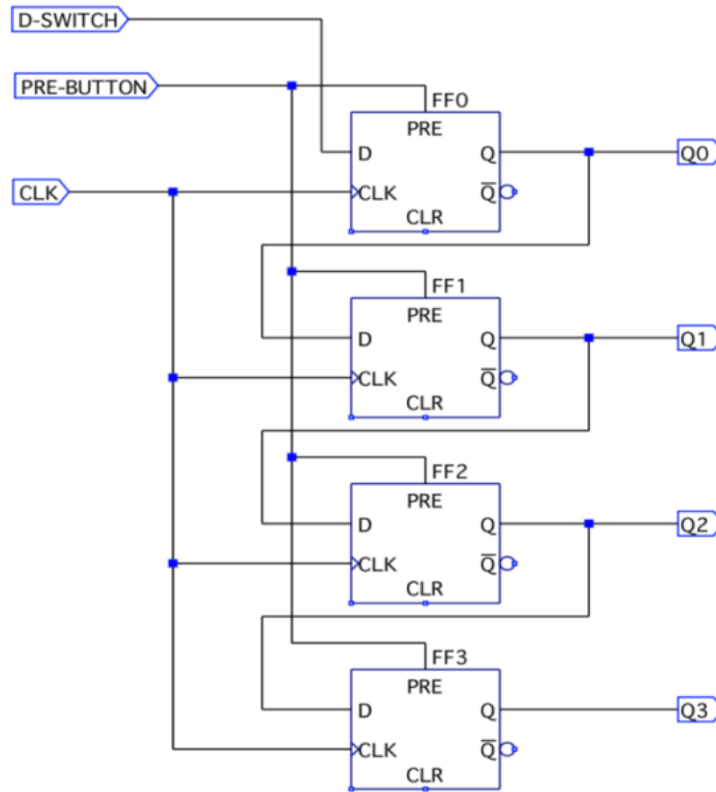


Figura 4

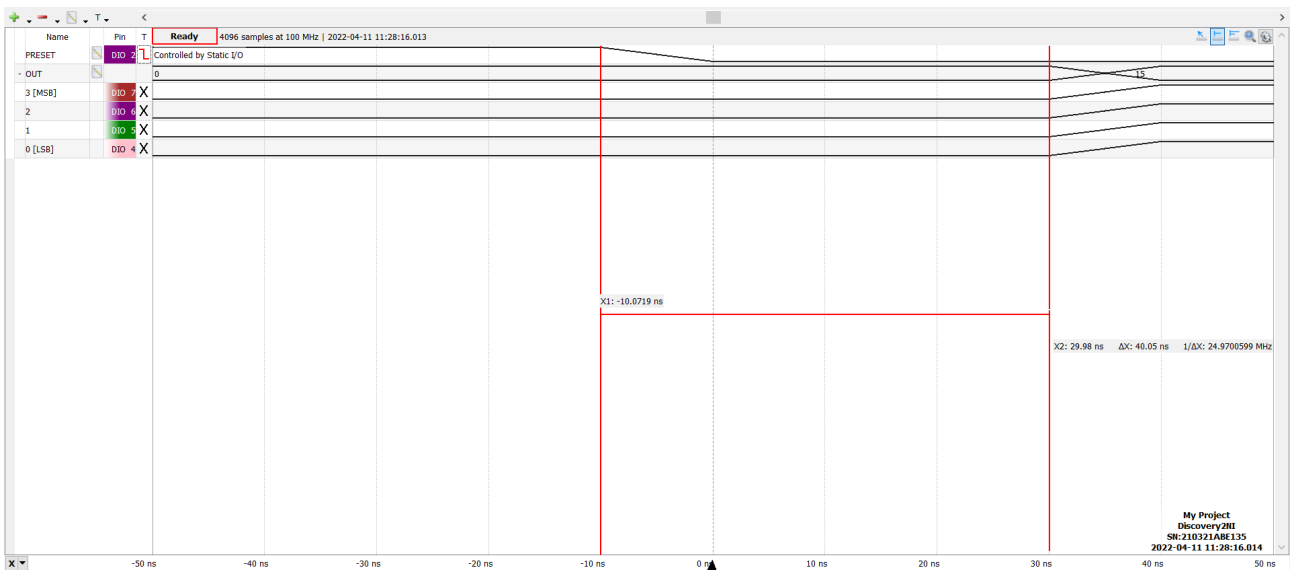


Figura 5: Acquisizione temporale con Logic dei segnali di PRE-BUTTON e i 4 segnali in uscita da un registro a scorrimento di 4 bit come illustrato in fig. 4

$t = t'$	$t = t' + \Delta T$
Q_0	Q'_0
Q_1	$Q_0(t=t')$
Q_2	$Q_1(t=t')$
Q_3	$Q_2(t=t')$

Tabella 2: Tabella "di verità" di un registro a scorrimento, Q'_0 è il valore che viene inviato durante l'impulso di clock tramite il D-SWITCH

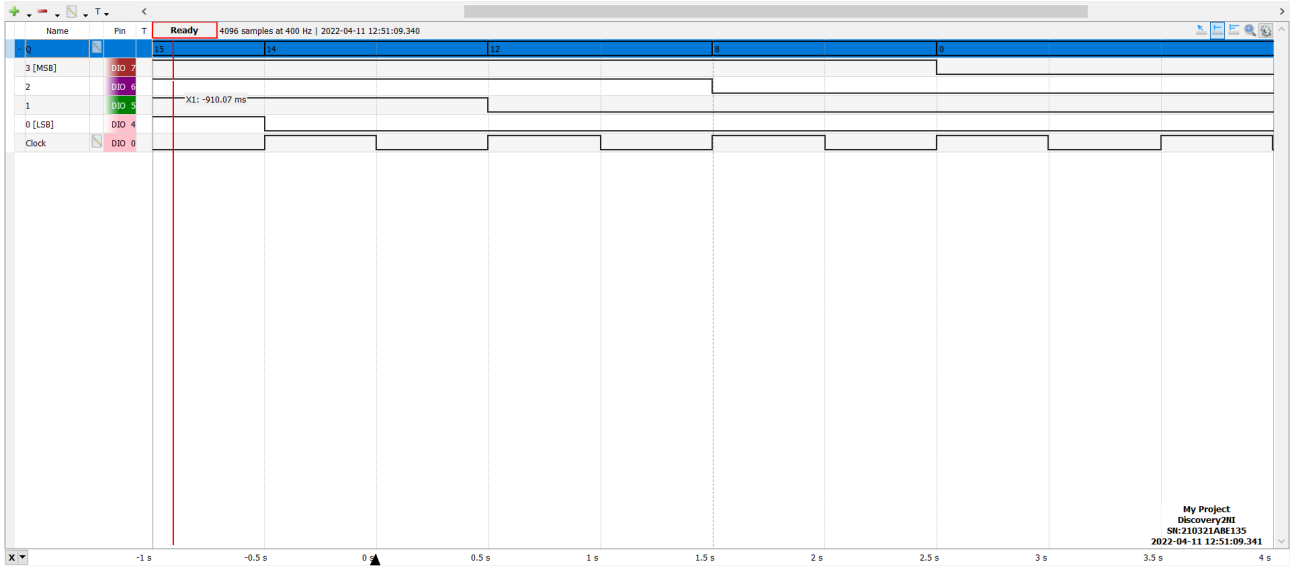


Figura 6: Acquisizione temporale con Logic dei segnali in uscita da un registro a scorrimento di 4 bit come spiegato in sezione 3.c

cambino. Dalla fig. 6 si verifica quanto detto prima, e le 4 uscite diventano (e si mantengono nel tempo visto che il D-Switch resta fisso a 0) tutte quante 0. Da questo si intuisce che collegando l'uscita Q_3 all'entrata del D-switch, possiamo generare una sequenza periodica.

3.d Prevalenza tra gli ingressi D-switch e PRESET

Utilizzando allo stesso tempo gli ingressi D -switch e PRESET del registro si vede che è l'ultimo a pilotare il segnale in uscita, dal momento che PRESET è asincrono (indipendente dalla salita del clock). Questo risulta consistente con la regola generale per cui le architetture asincrone prendono la precedenza sulle istruzioni sincrone.

3.e Contatore BCD con Flip Flop ad anello

Dopo aver impostato tutte le uscite a 0, si collega l'uscita \overline{Q}_3 all'entrata D del primo Flip-Flop e si invia un clock di frequenza pari a 1 kHz al circuito. Ci si aspetta che, prendendo un'uscita a caso, si osservi un segnale di clock di frequenza un quarto di quella di clock: questo effetto è dovuto a come la sequenza viene caricata nel registro a partire dall'uscita \overline{Q}_3 . In generale supponendo che nel circuito ci siano in cascata n Flip-Flop, e che tutte le uscite siano inizializzate a 0, in una qualsiasi delle uscite otterrò un clock di frequenza pari a $\frac{f_{clk}}{n}$.

4 Generatore di sequenze pseudo-casuali

4.a Costruzione del circuito

Si vuole ora costruire un generatore di sequenze pseudo-casuali a 4 bit utilizzando lo shift register costruito in precedenza e una porta XOR; la schematica del circuito che utilizzeremo è riportato in figura fig. 8.

4.b Analisi e verifica del funzionamento

Dopo aver montato il circuito si inizializzano tutti Flip-Flop a 1 e si invia un segnale di clock a 10 kHz per verificare il funzionamento: essendo il registro di lunghezza pari a 4 bit, dalla teoria ci aspettiamo che la sequenza si ripeta dopo $2^4 = 16$ eventi al massimo, condizione che si ottiene utilizzando come TAP (segnali in ingresso alla porta XOR, la cui uscita sarà inviata all'entrata D del primo Flip-Flop) le uscite Q_2 e Q_3 .

Dalla fig. 9 si verificano le aspettative per cui la sequenza generata a una qualsiasi uscita si ripete ogni 16 periodi di clock (essendo uno shift register la sequenza nelle altre uscite sarà la medesima, solo che saranno sfasate lungo l'asse temporale le une con le altre).

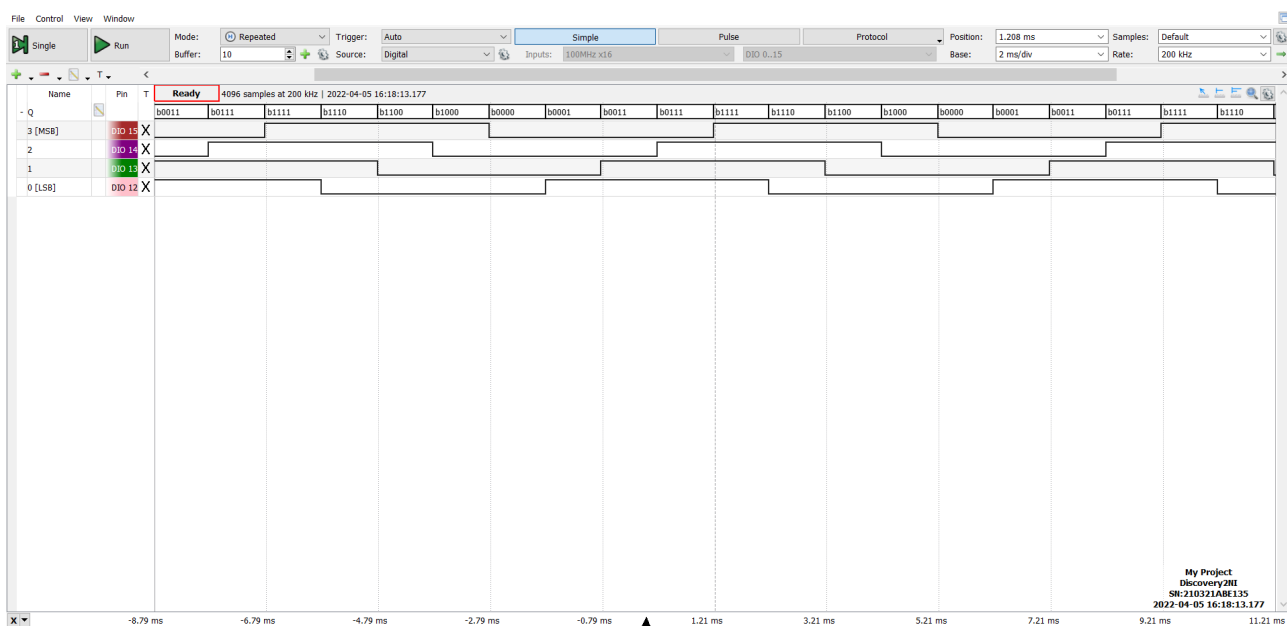


Figura 7: Acquisizione temporale con Logic dei segnali in uscita da un registro a scorrimento di 4 bit con l'ultima uscita negata collegata all'entrata del primo flip flop

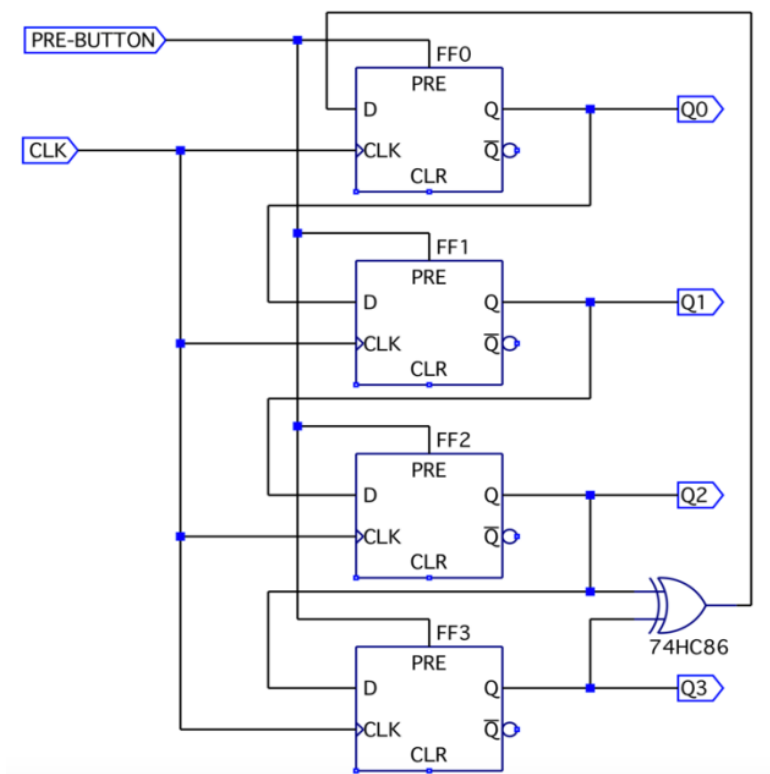


Figura 8

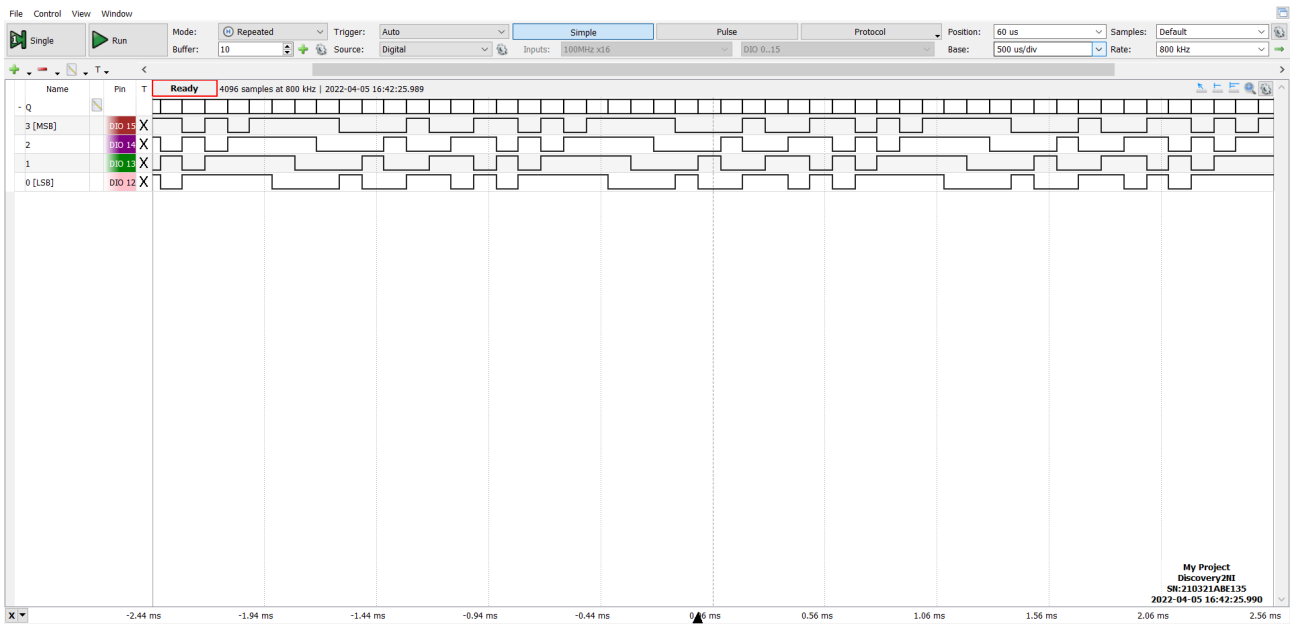


Figura 9: Acquisizione temporale con Logic del bus in uscita dal generatore di sequenze pseudo-casuale descritto in fig. 8

4.c Studio delle sequenze generabili con diverse condizioni iniziali

Si provano quindi altre combinazioni di TAP, per verificare che la scelta di utilizzare l'uscita Q_2 e Q_3 produce una sequenza più lunga rispetto a qualunque altra configurazione

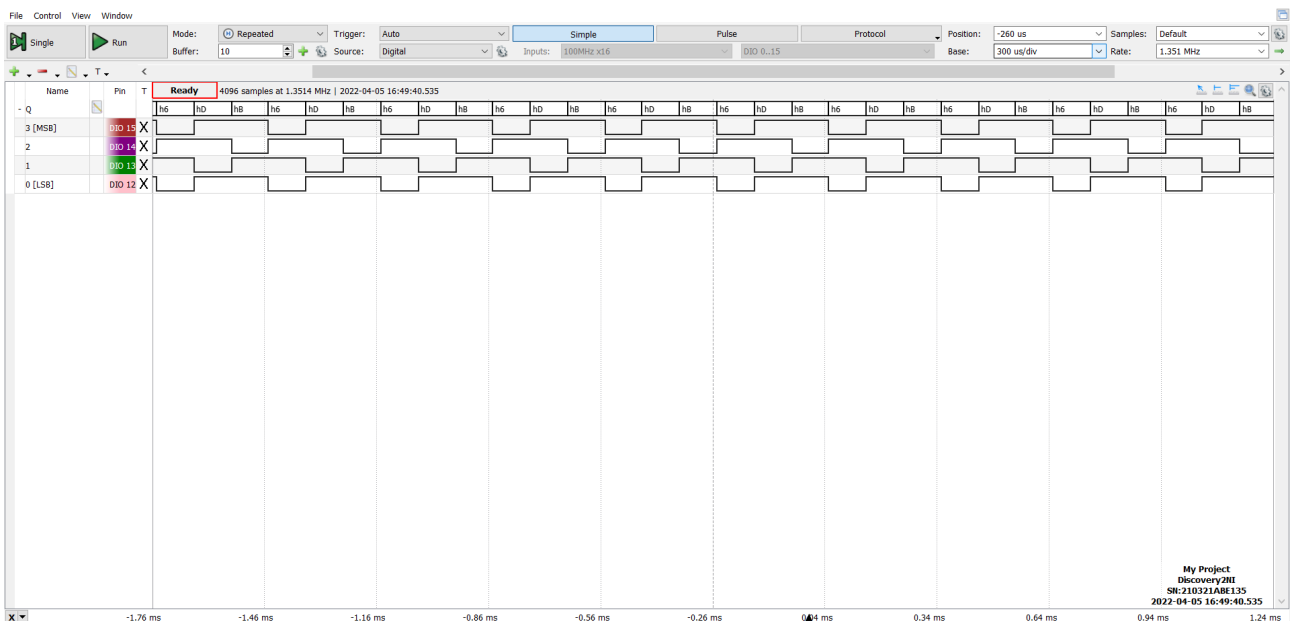


Figura 10: Acquisizione temporale con Logic del bus in uscita dal generatore di sequenze pseudo-casuale con TAP sulle uscite Q_0 e Q_1 , la sequenza si ripete ogni 4 eventi

5 Divisori di frequenza con contatori binari

5.a Costruzione del circuito

Si intende costruire un divisore di frequenza a partire da un contatore binario a 4 bit, utilizzando l'integrato SN74LS163, presente in fig. 13. Si vuole innanzitutto verificarne il funzionamento.

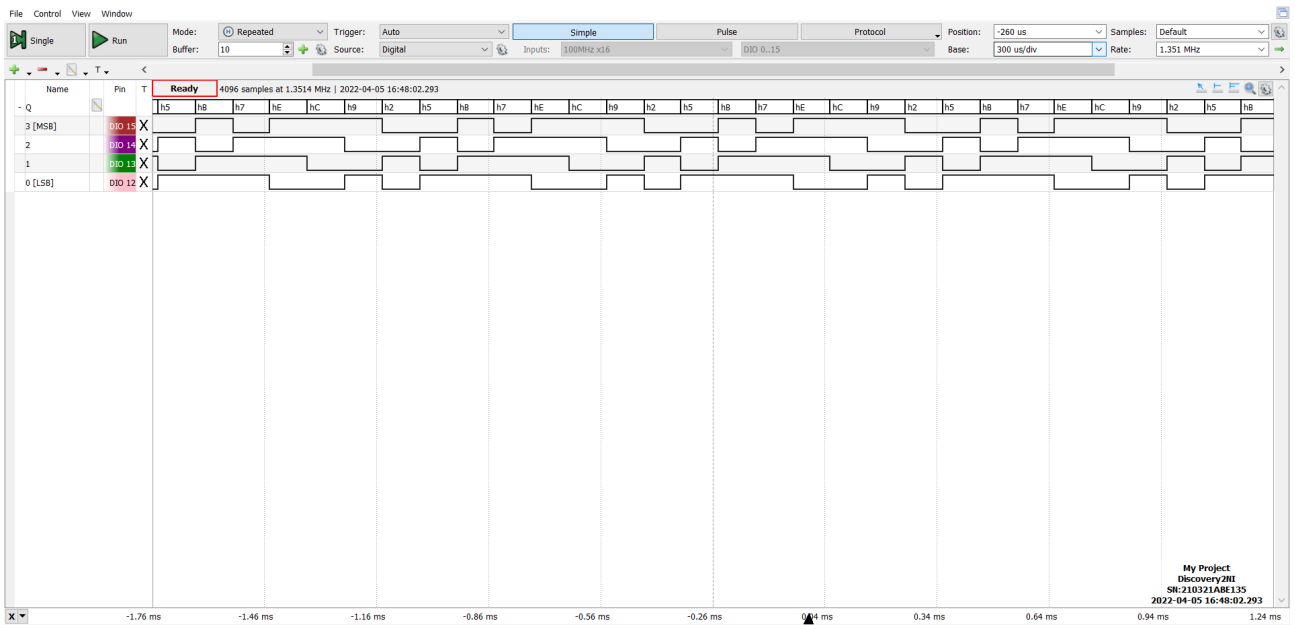


Figura 11: Acquisizione temporale con Logic del bus in uscita dal generatore di sequenze pseudo-casuale con TAP sulle uscite Q_2 e Q_1 , la sequenza si ripete ogni 8 eventi

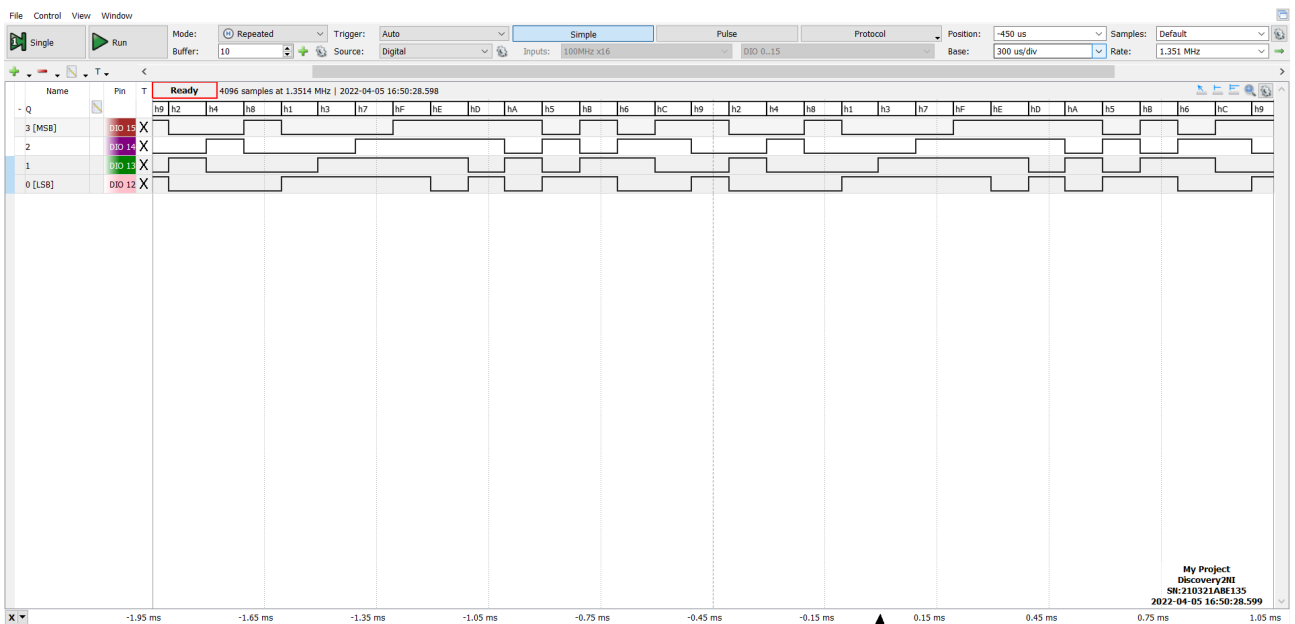


Figura 12: Acquisizione temporale con Logic del bus in uscita dal generatore di sequenze pseudo-casuale con TAP sulle uscite Q_0 e Q_3 , la sequenza si ripete ogni 16 eventi

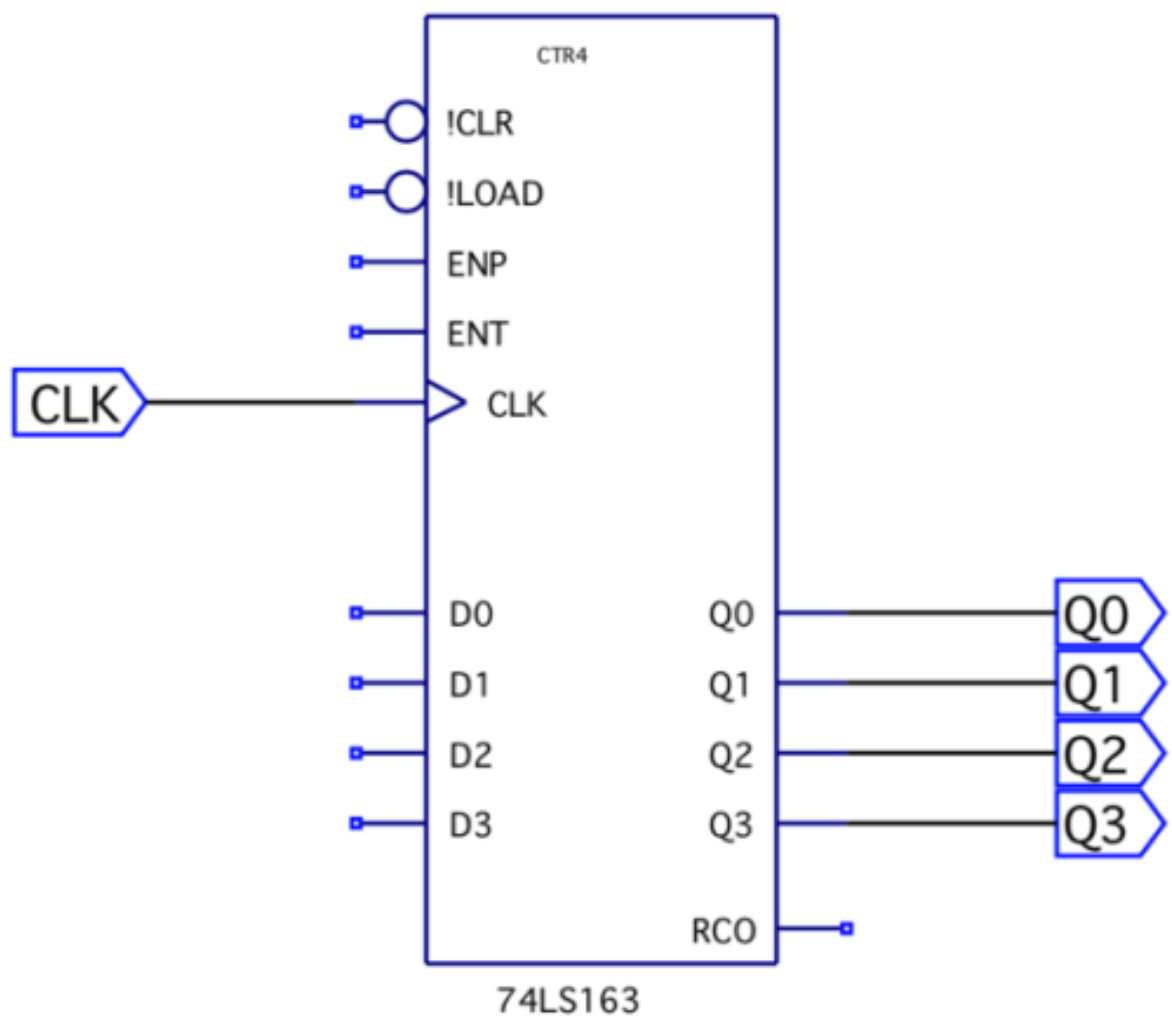


Figura 13

5.b Verifica del ciclo di funzionamento dei contatori

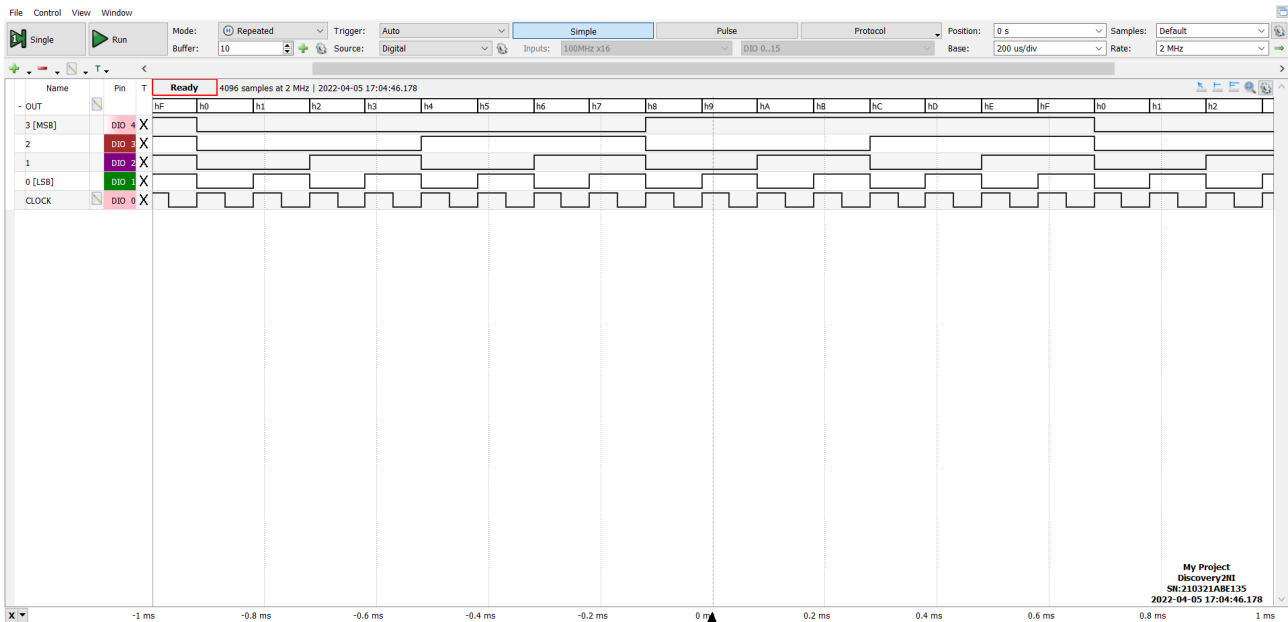


Figura 14: Acquisizione temporale con Logic del bus in uscita dal contatore, con frequenza di clock pari a 10 kHz

5.c Verifica della divisione in frequenza

5.d Transizione sincrona del contatore

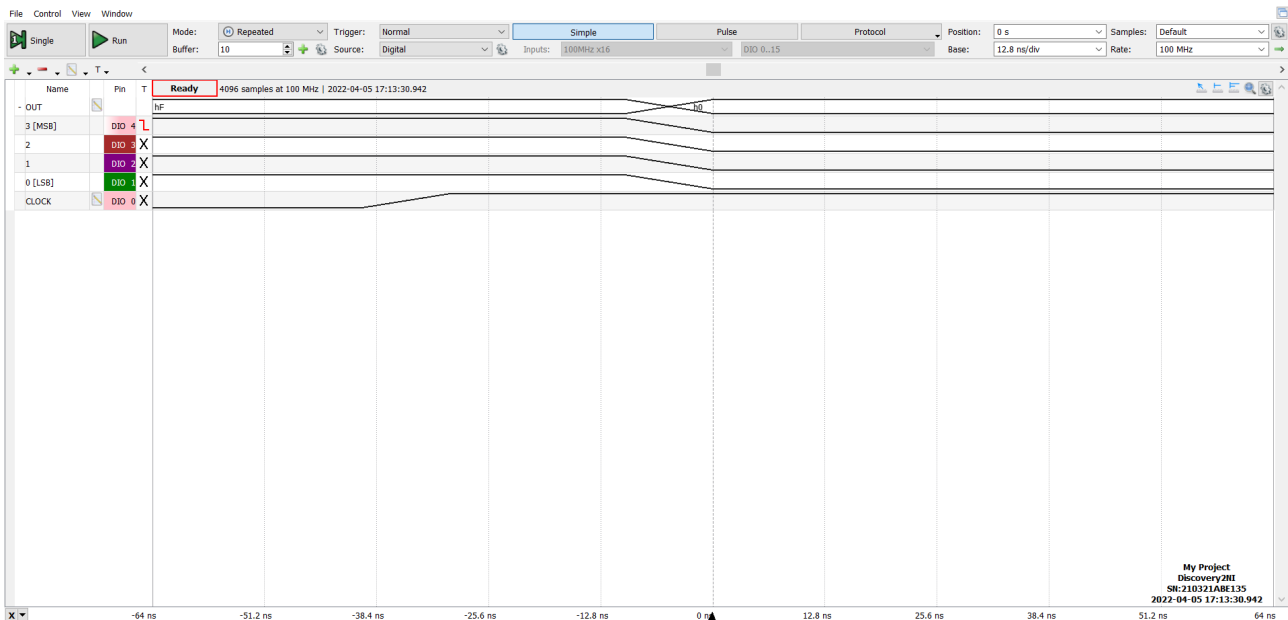


Figura 15: Acquisizione temporale con Logic del bus in uscita dal contatore durante la transizione 15->0; dall'immagine possiamo notare il comportamento sincrono della commutazione delle uscite del contatore

5.e Costruzione di un divisore di frequenza 1/10

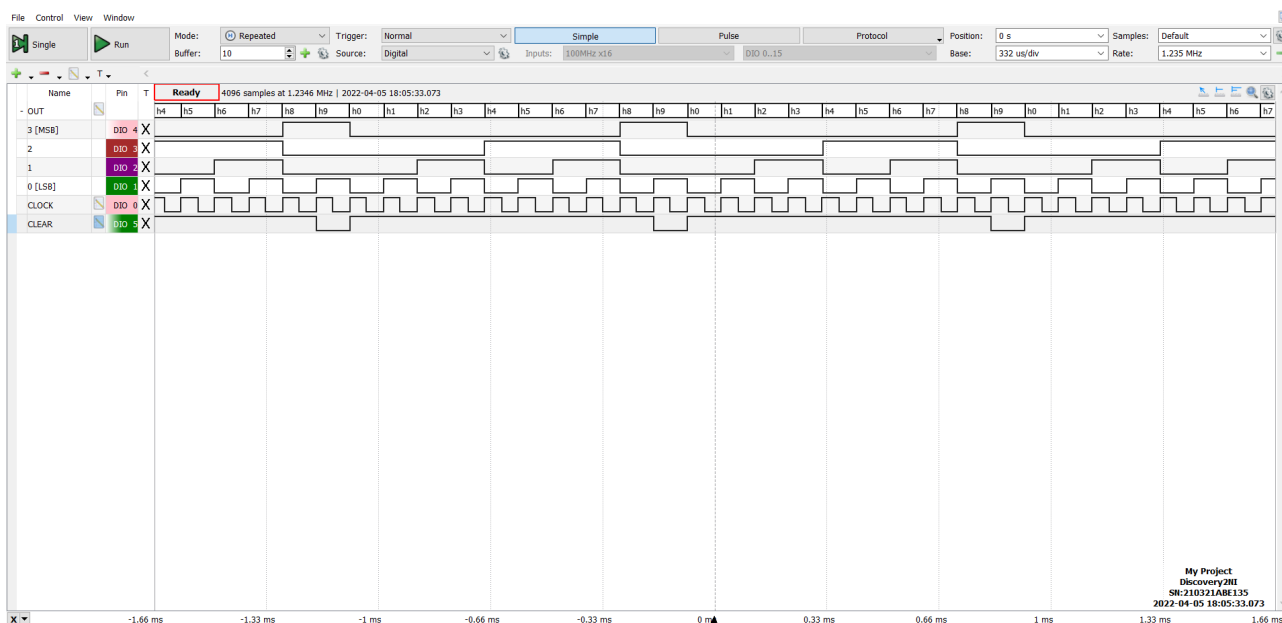


Figura 16: Acquisizione temporale con Logic del bus in uscita dal circuito che conta fino a 10; si può notare che il segnale in entrata nel Clock ha effettivamente periodo pari a 10 volte quello del clock

5.f Divisore di frequenza programmabile con RCO

5.g Misura dei tempi caratteristici del divisore RCO

5.h Analisi e verifica del comportamento del divisore RCO

6 Sintetizzatore musicale

Conclusioni e commenti finali

Si è riusciti a verificare il corretto funzionamento di circuiti logici sequenziali di crescente complessità e svariate applicazioni (e.g. crittografia, sistemi di controllo e misura) costruiti con porte NAND, XOR, D-Latch e contatori sincroni. In particolare sono stati realizzati e studiati un D-Latch, uno shift-register con positive edge-triggered D-FF, un generatore di sequenze pseudocasuali e alcuni tipi di divisore di frequenza con contatori binari. Inoltre si è riusciti ad apprezzare l'effetto dei tempi di propagazione delle porte sul loro comportamento, seppur in maniera limitata dalla bassa risoluzione temporale dell'AD2.

Dichiarazione

I firmatari di questa relazione dichiarano che il contenuto della relazione è originale, con misure effettuate dai membri del gruppo, e che tutti i firmatari hanno contribuito alla elaborazione della relazione stessa.